

Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-17410-01-01 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Gültig ab: **04.12.2025**

Ausstellungsdatum: 04.12.2025

Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-K-17410-01-00.

Inhaber der Akkreditierungsurkunde:

WIN Messmittel und Service GmbH
Wiesenring 33, 07554 Korbußen

mit dem Standort

WIN Messmittel und Service GmbH
Wiesenring 33
07554 Korbußen

Das Kalibrierlaboratorium erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser Anlage aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen. Das Kalibrierlaboratorium erfüllt gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschließlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdrücklich bestätigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für Kalibrierlaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

*Diese Urkundenanlage wurde ausgestellt durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH und ist digital gesiegelt.
Sie gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder.
Der jeweils aktuelle Stand der gültigen und überwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)*

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-17410-01-01

Kalibrierungen in den Bereichen:

Dimensionelle Messgrößen

Länge

- **Parallelendmaße**
- **Längenmessmittel**
- **Durchmesser**
- **Formabweichung**
- **Gewinde**

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Länge Parallelendmaße aus Stahl nach DIN EN ISO 3650:1999	0,5 mm bis 100 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 3.1:2004 Messung der Abweichung des Mittenmaßes l_c vom Nennmaß l_n durch Unterschiedsmessung	Für das Mittenmaß: $0,1 \mu\text{m} + 1 \cdot 10^{-6} \cdot l$ Für die Abweichungen f_o und f_u vom Mittenmaß: $0,07 \mu\text{m}$	l = Länge des Maßes in den Nennmaßen der Normale Messflächenqualität entsprechend den Festlegungen im QMH bzw. in den Arbeitsanweisungen Für die kleinsten Messunsicherheiten sind Anschiebbarkeit und Anschubmerkmale beider Messflächen des Kalibriergegenstands mit einer geeigneten Planglasplatte zu prüfen.
Parallelendmaße aus Keramik und Wolframcarbid nach DIN EN ISO 3650:1999	0,5 mm bis 100 mm	Messung der Abweichungen f_o und f_u vom Mittenmaß durch 5-Punkte-Unterschiedsmessung	Für das Mittenmaß: $0,12 \mu\text{m} + 1 \cdot 10^{-6} \cdot l$ Für die Abweichungen f_o und f_u vom Mittenmaß: $0,07 \mu\text{m}$	
Parallelendmaße aus Stahl nach DIN EN ISO 3650:1999	> 100 mm bis 1500 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 3.1:2004 in den Nennmaßen, die von denen der Normale max. 500 mm abweichen. Messung der Abweichung des Mittenmaßes l_c vom Nennmaß l_n durch Unterschiedsmessung	Für das Mittenmaß: $0,3 \mu\text{m} + 1,3 \cdot 10^{-6} \cdot l$	
Messuhren mit Skalenanzeige	bis 12,5 mm	VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 Blatt 11.1:2021	$3 \mu\text{m} + 10 \cdot 10^{-6} \cdot l$	l = gemessene Länge
Messuhren mit Ziffernanzeige	bis 12,5 mm	VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 Blatt 11.4:2020	$3 \mu\text{m} + 10 \cdot 10^{-6} \cdot l$	
Feinzeiger	bis 3 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 11.2:2002	0,7 μm	
Fühlhebelmessgeräte	bis 1,6 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 11.3:2002	1,2 μm	

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-17410-01-01

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)					
Messgröße / Kalibriergegenstand	Messbereich / Messspanne		Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Messschieber für Außen-, Innen- und Tiefenmaße	0 mm bis 300 mm		VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 9.1:2006	$30 \mu\text{m} + 30 \cdot 10^{-6} \cdot l$	$l = \text{gemessene Länge}$
Tiefenmessschieber	0 mm bis 300 mm		VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 9.2:2006	$30 \mu\text{m} + 30 \cdot 10^{-6} \cdot l$	
Höhenmessschieber	0 mm bis 300 mm		VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 9.3:2006	$30 \mu\text{m} + 30 \cdot 10^{-6} \cdot l$	
Einstellmaße für Bügelmessschrauben	25 mm bis 500 mm		VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.4:2009	$0,3 \mu\text{m} + 10 \cdot 10^{-6} \cdot l$	
Rachenlehren	3 mm bis 200 mm		VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.7:2005	$0,8 \mu\text{m} + 10 \cdot 10^{-6} \cdot l$	
Bügelmessschrauben	0 mm bis 300 mm		VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 10.1:2001	$3 \mu\text{m} + 10 \cdot 10^{-6} \cdot l$	$l = \text{gemessene Länge}$
Feinzeigermess- schrauben	0 mm bis 150 mm		VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 10.3:2002	$3 \mu\text{m} + 10 \cdot 10^{-6} \cdot l$	
Innenmessschrauben mit 2-Punkt-Berührung	20 mm bis 300 mm		VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 10.7:2010	$3 \mu\text{m} + 10 \cdot 10^{-6} \cdot l$	
Innenmessschrauben mit 3-Linien-Berührung	3 mm bis 200 mm		VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 10.8:2002	$3 \mu\text{m} + 10 \cdot 10^{-6} \cdot l$	$l = \text{gemessene Länge}$
Lehrringe Durchmesser	5 mm bis 200 mm		VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.1:2006 Option 3 und 4	$0,8 \mu\text{m} + 10 \cdot 10^{-6} \cdot d$	
Rundheitsabweichung	bis 40 μm		VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.1:2006 Option 1 und 2	0,4 μm	
Parallelitätsabweichung und Geradheitsabwei- chung	bis 40 μm			0,8 μm	
Lehrdorne Durchmesser	3 mm bis 200 mm		VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.1:2006 Option 3 und 4	$0,8 \mu\text{m} + 10 \cdot 10^{-6} \cdot d$	
Rundheitsabweichung	bis 40 μm		VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.1:2006 Option 1 und 2	0,4 μm	
Parallelitätsabweichung und Geradheitsabwei- chung	bis 40 μm			0,8 μm	
Prüfzylinder, Prüfdorne Durchmesser	3 mm bis 200 mm		VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.6:2014	$0,8 \mu\text{m} + 10 \cdot 10^{-6} \cdot d$	$d = \text{gemessenerDurchmesser}$
Rundheitsabweichung	bis 40 μm		VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.6:2014	0,4 μm	
Parallelitätsabweichung und Geradheitsabwei- chung	bis 40 μm			0,8 μm	

Permanentes Laboratorium

Kalibrier- und Messmöglichkeiten (CMC)				
Messgröße / Kalibiergegenstand	Messbereich / Messspanne	Messbedingungen / Verfahren	Erweiterte Messunsicherheit	Bemerkungen
Prüfstifte / Gewindeprüfstifte Durchmesser	3 mm bis 20 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.2:2007 Option 1	$0,8 \mu\text{m} + 10 \cdot 10^{-6} \cdot d$	$d = \text{gemessener Durchmesser}$
Rundheitsabweichung	bis 40 μm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.2:2007 Option 2	0,4 μm	
Gewindelehrnen (eingängige zylindrische Außen- und Innengewinde mit geradlinigen Flanken und symmetrischem Profil)				
Außen Gewinde Einfacher Flankendurchmesser mit Nennsteigung $\geq 0,25 \text{ mm}$	1 mm bis 200 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.8:2006 Option 1	$3,5 \mu\text{m} + 10 \cdot 10^{-6} \cdot d$	$d = \text{gemessener Durchmesser}$ Einfacher Flankendurchmesser (simple pitch diameter)
Innengewinde Einfacher Flankendurchmesser mit Nennsteigung 0,5 mm bis 6,0 mm	5 mm bis 100 mm	VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.9:2006 Option 1	$3,5 \mu\text{m} + 10 \cdot 10^{-6} \cdot d$	

Verwendete Abkürzungen:

CMC	Calibration and measurement capabilities (Kalibrier- und Messmöglichkeiten)
DGQ	Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V.
DIN	Deutsches Institut für Normung e.V.
DKD	Deutscher Kalibrierdienst
EN	Europäische Norm
IEC	International Electrotechnical Commission – Internationale Elektrotechnische Kommission
ISO	International Organization for Standardization – Internationale Organisation für Normung
VDE	Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik e.V.
VDI	Verein Deutscher Ingenieure e.V.